

陽電子消滅寿命／ドップラー拡がり測定装置

日本製

寿命測定・ドップラー拡がり測定・AMOC測定

SYSTEM

20180926

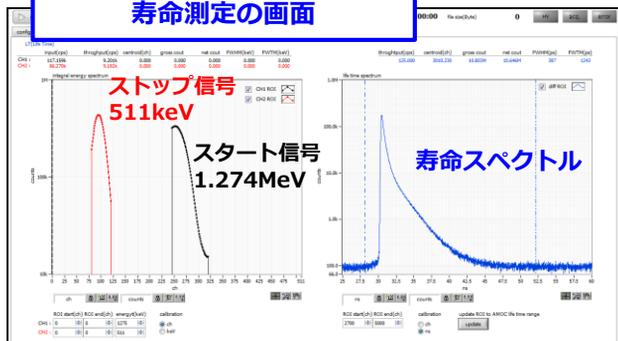
分子レベルのナノスケール空間構造を解析できる陽電子消滅法の測定に必要な計測・電源機器が一つになりました。**寿命測定**では2台のBaF₂シンチレータからの高速パルス信号を3GSPSのボードで取り込み寿命時間を算出。**ドップラー拡がり測定**では2台のGe半導体検出器からコインシデンスを取り波高値から2次元ヒストグラムを生成。さらにこれらの機器の組み合わせにより寿命と運動量の相関をとる**AMOC測定**も実現しました。



【高さ】約32cm 【幅】約17cm
【奥行】約40cm

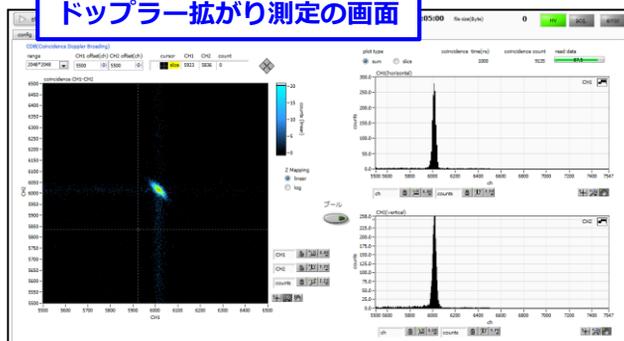
機能	1.寿命測定 2.ドップラー拡がり測定 3.AMOC測定
ADC	2チャンネル 3GSPS 8-bit (寿命用) 2チャンネル 100MSPS 14-bit (ドップラー拡がり用)
時間分解能	FWHM 192ps (511keV@ ²² Na) *検出器による FWHM 160~190ps (認証標準石英ガラス) *検出器による
エネルギー分解能	1.23keV (512keV@ ¹⁰⁶ Ru) 1.69keV (1.33MeV@ ⁶⁰ Co)
高圧電源	2CH: -4000V / CH (光電子増倍管用) 2CH: +5000V / CH (Ge半導体検出器用) *プリアンプ電源有
通信	イーサネット (TCP/IP)
ソフトウェア	データ収集用アプリケーション

寿命測定画面

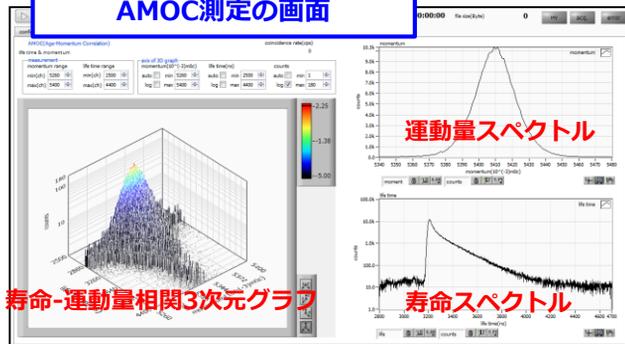


線源：²²Na 試料：ポリカーボネート

ドップラー拡がり測定画面



AMOC測定画面



試料：石英ガラス

システム設置イメージ写真



※写真はイメージです。
※記載内容は予告なく変更することがあります。



放射線・放射能測定装置 ◆設計・開発・販売◆

株式会社 テクノエーピー

〒312-0012茨城県ひたちなか市馬渡2976-15

☎ 029-350-8011

☎ 029-352-9013

✉ order@techno-ap.com